



オーシャンフォトニクス社製

可視近赤外透過測定用分光測定システム

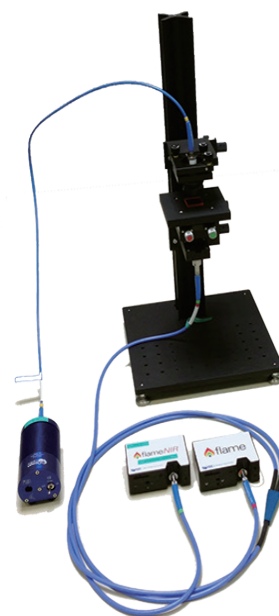
# OP-SpecWide-TR

OP-SpecWide-TR は、小型で安価なマルチチャンネル分光器 Flame-T、近赤外対応の Flame-NIR+ の異なる波長域を持つ 2 台の分光器の組合せにハロゲン光源、サンプルホルダ、2 分岐ファイバを加え、可視から近赤外域 (400 ~ 1700 nm) までの幅広い測定範囲をカバーした安価型の広帯域分光透過測定システムです。

シリコン CCD デテクタ搭載の Flame-T 分光器で可視域の測定に、また InGaAs デテクタ搭載の Flame-NIR+ で近赤外域の測定に対応し、付属の分光測定用標準ソフトウェア OPwave+ で 2 つのスペクトルの表示、データ保存が可能です。

異なる 2 つの分光器の組み合わせで、広帯域の分光光度計と同様の測定システムとしてご使用いただけます。サンプルホルダ、光学ステージの選択により、様々な液体試料から固体試料の透過 / 吸光度測定に対応が可能です。

※ 紫外域～近赤外域対応をご希望の際はご相談ください。

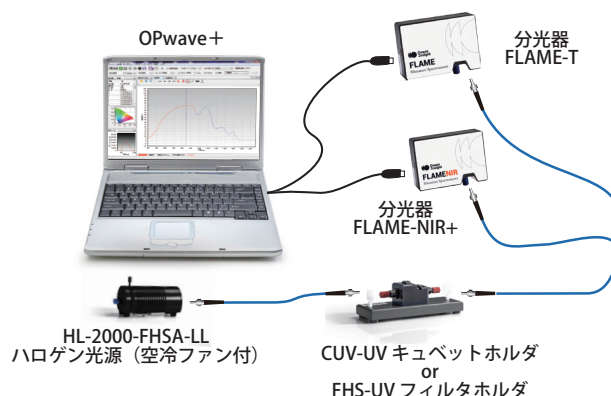


## アプリケーション

- 液体試料の透過測定
- 食品、農産物の透過測定による分光分析
- レンズ・フィルタなど光学部品の透過測定
- 半導体、太陽電池基板、ガラス材料などの透過測定

## システム構成例

- FLAME-T ファイバマルチチャンネル分光器  
グレーティング #3: 350 ~ 1000nm / 入射スリット幅 5um
- Flame-NIR+ 近赤外ファイバマルチチャンネル分光器  
グレーティング # NIR3: 970 ~ 1700 nm / 入射スリット幅 25um
- HL-2000-FHSA-LL ハロゲン光源 (空冷ファン付)
- CUV-UV キュベットホルダ or FHS-UV 固体試料ホルダ
- 光源 ↔ サンプルホルダ接続用ファイバ
- サンプルホルダ ↔ 分光器接続用 2 分岐ファイバ
- OPwave+ 分光測定用標準ソフトウェア

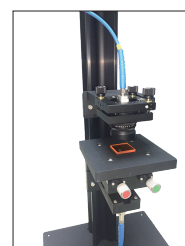


## 特注光学ステージ

サンプルホルダ、サンプルステージなど、特注対応します。ご相談ください。

- 透過・反射測定に対応
- $\alpha$   $\beta$  ステージ付入射 / 受光ユニット
- $\alpha$   $\beta$  ステージ付サンプル面板
- 入射・受光ユニットレベルアジャスタ

\* 測定方法、サンプルサイズなどによりカスタム対応可能



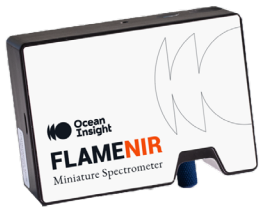
## FLAME-T マルチチャンネル分光器



< VIS 域対応 >

- ・ディテクタ：3648 素子リニアシリコン CCD アレイ
- ・グレーティング #3: 350 ~ 1000nm (推奨)
- ・入射スリット幅 5um (推奨)
- ・波長分解能 1.02nm (参考値) \* 上記グレーティング、スリット採用時
- ・A/D 分解能：16bit
- ・積算時間：3.8msec. ~ 10 sec.

## Flame-NIR+ 近赤外マルチチャンネル分光器



< NIR 域対応 >

- ・ディテクタ：128 素子 InGaAs アレイ (非冷却)
- ・グレーティング 970 ~ 1700 nm
- ・入射スリット幅 25um (推奨)
- ・波長分解能 (参考値) 10nm
- ・A/D 分解能：16bit
- ・積算時間：1msec ~ 65 sec

## HL-FHSA-LL ハロゲン光源 (空冷ファン付)



- ・波長範囲：360 ~ 2400nm
- ・アッテネータ、シャッター付
- ・バルブ寿命 (Typ.)：10000 時間
- ・バルブ色温度：2800K

## OPwave+ 分光測定用標準ソフトウェア

- ・簡単日本語表示
- ・透過・吸光度・反射測定モードに対応
- ・データ保存 (text 形式)、呼び出し、プリントアウト
- ・スペクトル経時変化測定、データ保存
- \* 指定波長測定、指定波長域測定、指定時間間隔測定
- ・保存波形データの重ね書き機能
- ・露光時間、平均化、ボックスカー設定
- ・一時停止、手動1スキャンデータ取得
- ・無償アップデート対応
- ・ユーザーご要望の機能追加、カスタマイズ可能 (オプション)

